上海仁机仪器仪表有限公司 --核检测仪器制造商--www.radtek.cn 021-61649690

2011 年 2 月	宇航计测技术	Feb. ,2011
第31卷 第1期	Journal of Astronautic Metrology and Measurement	Vol. 31, No. 1

文章编号:1000-7202(2011) 01-0062-05

文献标识码:A

低本底 α 、 β 测量仪效率校准研究

常钟泽 漆明森 程 瑛 许 荩 王 旭 洪永侠 (中国核动力研究设计院一所,成都 610005)

摘 要 简述了低本底 α₄β 测量仪效率校准的基本原理,研究了自吸收和面积与探测效率的关系,评定了 效率校准中的不确定度,并分析了效率在 α₄β 样品测量中的应用。

关键词 低本底 α、β 测量仪 效率校准 自吸收 面积

The Research of Efficiency Calibration of Low-background α , β -measuring Instrument

CHANG Zhong-ze QI Ming-sen CHENG Ying XU Jin WANG Xu HONG Yong-xia (Nuclear Power Institute of China, Chengdu 610005)

Abstract This paper gives a sketch of the basic principle of low-background α , β -measuring instrument. It explores the relationship between the self-absorption, area and measuring efficiency. It gives out that the uncertain degree of efficiency calibration and analyses the application for the measuring of α , β -samples with efficiency.

Key words Low-background α , β -measuring instrument Efficiency calibration Self-absorption Area

1 引 🗎

低本底 α、β 测量仪具有测量灵敏度高、本底 低、仪器长期稳定性好等特点,因此广泛用于环境样 品、退役样品、核电站、反应堆、进出口商品、饮用水、 医药卫生、同位素生产、生物样品等方面的弱 α、β 放射性测量,是一种不可或缺的常规测量手段^[1]。

低本底 α 、 β 测量仪是相对测量装置,效率校准 的准确度是保证测量装置量值准确可靠的重要前 提,而效率与源的自吸收、被校样品尺寸等因素有 关。本工作制备了不同尺寸的⁴⁰K标准源样品,分 别对低本底 α 、 β 测量仪进行效率校准,研究了样品 尺寸、自吸收等与探测效率的关系,为弱 β 放射性活 度量值传递的准确可靠提供了计量保障。

2 测量设备

2.1 天平

天平选用 AG245 型电子微量天平,用于对标准物质进行称量,其主要技术指标如下:

•测量范围:0.01mg~41g;

• 允许误差极限:0.01mg。

2.2 低本底 α、β 测量仪

低本底 α_{β} 测量仪采用 FJ – 2600 中面积低本 底测量仪,该测量仪主要用于测量微弱放射性样品 中的 α_{β} 放射性强度,其主要技术指标如下:

• A 本底计数率不大于 0.4cpm, β 本底计数率 不大于 4cpm; 第1期

• β高压:2.8kV,阈值:3.0;

•工作气体:纯度为 99.99% 的甲烷,流量:约 20ml/min;

• 测量的基本误差:≤±15%。

2.3 样品托盘

样品托盘采用不锈钢托盘,尺寸共5种,分别为 **Φ**24、**Φ**30、**Φ**38、**Φ**44 和 **Φ**50。

2.4 标准物质

采用分析纯 KCl 晶体,比活度为 14.6Bq/g。

2.5 筛子

采用100目不锈钢筛,孔径为0.154mm。

2.6 烘箱

采用 DB-210SCB 型电热鼓风恒温干燥箱,其 主要技术指标如下:

- 温度范围: 10℃~300℃;
- 功率:3kW。
- 2.7 无水乙醇

采用分析纯无水乙醇,乙醇含量不小于99.7%。

3 样品的制备

选取不锈钢样品托盘 12 个,用普通水清洗,烘 干后用无水乙醇清洗,晾干后用一次蒸馏水冲洗后, 烘干并编号。

将 KCl 晶体置于研钵中研磨, 经筛子过筛, 105℃烘烤4小时以上后,反复称量、烘烤直至恒重。

将收集到的标准物质按所需质量通过筛子均匀 地撒在不锈钢样品托盘中。

用以上方法制得两组样品,共12个。

4 效率校准

4.1 校准原理

使用已知活度 A 的标准源对低本底 α 、 β 测量仪 进行活度效率校准。测量得到样品计数率为 n,本底 计数率为 n_b ,根据式(1)得到 β 活度探测效率 η

$$\eta = \frac{n - n_b}{A} \tag{1}$$

很多情况下我们还会采用另一种探测效率,称之 为表面发射率探测效率,其计算公式(2)如下所示

$$\eta' = \frac{n - n_b}{q_{2\pi}} \tag{2}$$

式中: η' ——表面发射率探测效率; $q_{2\pi}$ ——标准 源表面发射率。

4.2 探测效率的应用

低本底 α、β 测量仪是相对测量装置,效率校准 的准确度在保证测量仪量值准确可靠中至关重要。

在检测工作中,当样品的尺寸与检定/校准所用 标准源尺寸相当时,用已经进行了效率校准的低本 底 α、β 测量仪对检测样品进行测量后,可根据下式 直接计算得出样品的总β 活度

$$A = \frac{n - n'}{n}$$

式中: η ——活度效率。

同样,如果采用表面发射率效率 η' ,则

$$q_{2\pi} = \frac{n - n'}{\eta'}$$
$$A = q_{2\pi} / \varepsilon_s$$

式中: ε_s ——源效率, ε_s 与射线能量、衬底材料和源 结构等因素有关。GBT 14056.1 – 2008《表面污染 测定 第一部分 β 发射体(E β max0.15MeV)和 α 发 射体》中推荐,对 β 标准平面源 ε_s =0.5^[2]。

当样品的尺寸与检定/校准所用标准源尺寸不同时,用已经进行了效率校准的低本底 α、β测量仪 对检测样品进行测量后,样品的总β活度的计算也 需进行自吸收修正与面积修正如下

$$A = \frac{n - n'}{\eta} k_c k_s$$
$$A = \frac{n - n'}{\eta' \varepsilon_s} k_c k_s$$

式中, k_c —— 自吸收修正因子; k_s —— 面积修正因子; c_s —— 面积修正因子。

4.3 样品活度及表面发射率的确定

准确称量 KCl 晶体的质量 m,已知 KCl 晶体比 活度 a,根据下式计算得到样品总β 活度 A

$$A = ma$$

式中: a ——KCl 晶体比活度, 14.6Bq/g。

对于标准源表面发射率 $q_{2\pi}$,可直接通过 2π 多 丝正比计数器测定。

4.4 自吸收修正因子的确定

平面源的自吸收是源材料本身对自身发射的β 辐射的吸收,将导致计数率的显著降低,从而影响活 度效率校准。源材料质量厚度越大,对计数率和效率

上海仁机仪器仪表有限公司 --核检测仪器制造商--www.radtek.cn 021-61649690

•	64	٠
---	----	---

宇航计测技术

2011 年

的影响越大。

用低本底 α、β 测量仪对面积为 φ 25 而质量厚 度不同的 7 个样品进行测量,得到样品计数率,按式 (1)计算得到活度探测效率,样品测量数据如表1所示。

表 1 样品效率校准测量数据							
	1*	2#	3*	4*	5*	6*	7*
计数率(min ⁻¹)	237.3	444.2	599.0	662.7	720.1	746.0	769.8
重复性(%)	0.87	1.27	1.13	0.12	1.31	0.68	0.81
质量厚度(g/cm ²)	0.028	0.066	0.108	0.135	0.168	0.187	0. 193
活度探测效率(%)	0.494 87	0.392 91	0.323 19	0.285 71	0.248 81	0.231 55	0.232 20



图1 自吸收与活度探测效率关系图

如图1所示,将表1的结果用最小二乘法按指数拟合,得到式(3)

 $\varepsilon = 0.542e^{-4.5754m}$ (3)

式中: *e* ——对应于质量厚度为 *m* 时的活度探测效 率;0.542 ——质量厚度为 0(无自吸收)时的活度 探测效率;4.5754——吸收系数; *m* ——质量厚度, g/cm²。

则

$$L - a^{4.5754m}$$

当质量厚度为 200mg/cm²时, $k_c = 2.197$; 当质量厚度为 300mg/cm²时, $k_c = 3.946$; 当质量厚度为 400mg/cm²时, $k_c = 6.235$ 。

4.5 面积修正因子的确定

在进行探测效率测试中,因放射源尺寸的不同, 致使源对探测器构成的几何因子不同,几何因子是 决定探测效率的主要因素之一。效率校准时所用标 准源的活性区的面积应与探测器灵敏面积相当,此 时几何因子为1;否则应根据放射源的尺寸对几何 因子进行修正^[3]。

用低本底 α、β 测量仪对质量厚度为 0.094g/ cm² 而面积不同的5 个样品进行测量,得到样品计数 率,按式(1)计算得到活度探测效率,样品测量数据 如表 2 所示。

表 2 样品效率校准测量数据

编号	8*	9*	10*	11*	12*
计数率 (min ⁻¹)	138.6	214.5	336.9	448.5	545.6
重复性(%)	2.30	0.79	0.49	0.68	1.63
表面半径 (mm)	12	15	19	22	25
活度探测 效率(%)	0. 370 98	0. 37 0 78	0. 361 80	0.357 05	0.337 62



图 2 面积与计数率关系图

第1期

如图 2 所示,将表 2 的结果用最小二乘法按二 项式拟合,得到式(4)

$$\varepsilon' = -0.0003x^2 + 0.0069x + 0.3244$$
 (4)

式中: ϵ' ——对应于表面半径为x且质量厚度一定时的活度探测效率;x——样品表面半径, mm_{\circ}

如果面积按 φ 50 进行归—,得到 k = 1, 175

$$k_{s\varphi 30/\varphi 50} = 1.165$$

 $k_{s\varphi 30/\varphi 50} = 1.107$

4.6 样品活度测量结果的不确定度评定

活度活度探测效率 η 的数学模型为

$$\eta = \frac{n - n_b}{A} k_c k_s$$

4.6.1 输入量 n 的不确定度 u₁ 评定

输入量 n 的不确定度主要来源于样品测量时计 数统计引入的不确定度,可以通过连续测量得到,采 用 A 类方法评定。

选用 FJ-2600 中面积低本底测量仪对标准源 样品连续测量 6 次,数据见表 3。

	表3 标准源样品的计数统计测量数据					
标准源 样品			计数率	(min ⁻¹)		
β	721.1	728.8	737.3	711.2	721.7	733.4

用单次实验相对标准偏差表示计数统计引入的 不确定度,其计算公式如下

$$s = \frac{1}{\bar{x}} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{j} (x_i - \bar{x})^2}{j - 1}} = 1.31\%$$

式中:s——单次实验相对标准偏差; \bar{x} ——测量平均值; x_i ——单次测量值;j——测量次数。

测量次数为6次,测量结果采用平均值,则输入量 n 的不确定度为

$$u_1 = \frac{1.31\%}{\sqrt{6}} = 0.54\%$$

4.6.2 输入量 n_b 的不确定度 u₂ 评定

输入量 n_b 的不确定度主要来源于仪器本底的 统计涨落,可以通过连续测量本底得到,采用 A 类 方法评定,β本底计数测量结果见表4。

表4 仪器本底测量结果

测量		ナウリ	**	· -1 \		平均值	标准
名称		平底订致率(min ⁻)			(\min^{-1})		偏差
β	5.8	5.2	4.8	4.4	6.2	5.29	0.14

用本底测量的标准偏差与β测量平均值减去本 底平均值之差的比值表示本底计数统计涨落引入的 不确定度,数据处理如下

 $u_2 = \frac{0.14}{193.1 - 5.29} \times 100\% = 0.08\%$

4.6.3 输入量 A 的不确定度的评定

输入量 A 的不确定度主要包括样品的比活度 和称量引入的不确定度,采用 B 类方法评定。

(1)样品比活度的不确定度 u3 的评定

分析纯 KCl 晶体的比活度为(14.6±0.2) Bq/g,则样品比活度的不确定度为

 $u_3 = \frac{0.2}{14.6} \times 100\% = 1.4\%$

(2)称量的不确定度 u4 的评定

由 AG245 天平的检定证书可知,在(0~41)g 范 围内,天平的极差为 ± $\frac{1}{2}$ $\sqrt{0.000 \ 11^2 + 0.000 \ 12^2}$ ≈ ±0.000 081g,其半区间宽度即为 0.000 081g,在 区间内认为服从均匀分布,包含因子为 $\sqrt{3}$ 。因此, 天平 的 极 差 引 入 的 不 确 定 度 为 $\frac{0.000 \ 081}{\sqrt{3}}$ ≈ 0.000 047g,又根据称量样品的质量为 295.4mg。

0.000 04/g, 又根据称量样品的质量为 295.4mg, 因此得到称量 u₄ 引入的标准不确定度 u₄

$$u_4 = \frac{0.000\ 047}{0.295\ 4} \times 100\% = 0.02\%$$

4.6.4 修正因子 k_c 的不确定度 u_s 的评定
按下式计算各个质量厚度的自吸收系数偏差δ

$$\delta_i = (y_i' - y_i) / y_i \times 100\%$$

式中: y_i'—— 样品为某一质量厚度时实际校准所得的探测效率; y_i ——代入某一质量厚度时, 经拟合公式计算得到的探测效率。

质量厚度在(20~200)mg/cm²的范围内,自吸收系数最大偏差小于4%,在此区间内,认为服从均

· 66 ·

宇航计测技术

2011年

匀分布,包含因子取、3,则标准不确定度

$$u_5 = \frac{4\%}{\sqrt{3}} = 2.4\%$$

4.6.5 修正因子 k, 的不确定度 u₆ 的评定
按下式计算不同面积修正因子的偏差 δ'

$$\delta_i' = (z_i' - z_i)/z_i \times 100\%$$

式中, z_i'—— 样品表面对应于某一半径时实际校准 所得的探测效率; z_i ——代入某一表面半径时, 经拟 合公式计算得到的探测效率。

经计算,样品表面半径在(10~25)mm 的范围 内,修正因子 k,最大偏差小于10%,在此区间内,认 为服从均匀分布,包含因子取、3,则标准不确定度

$$u_6 = \frac{10\%}{\sqrt{3}} = 5.8\%$$

探测效率测量结果标准不确定度汇总见表6。

5 结束语

本工作将⁴⁰K 制成不同尺寸的标准源样品,分 别对低本底 α , β 测量仪进行效率校准:质量厚度为 200mg/cm²时,自吸收修正因子为 2.197;质量厚度 为 300mg/cm²时,自吸收修正因子为 3.946;质量厚 度为 400mg/cm²时,自吸收修正因子为 6.235; φ 20 面积相对于 φ 50 的面积修正因子为 1.175; φ 30 面 积相对于 φ 50 的面积修正因子为 1.165; φ 40 面积

表6 掛	罙测效率测量结界	具不确定度汇总表
不确定度分量	不确定度来源	标准不确定度分量(%)
<i>u</i> ₁	计数统计	0. 54
<i>u</i> ₂	本底修正	0.08
<i>u</i> ₃	样品比活度	1.4
u_4	称量	0.02
u_5	自吸收修正	2.4
u ₆	面积修正	5.8
合成标准	不确定度	6.5

相对于 φ50 的面积修正因子为 1.107。因此,需要 对检定/校准以及检测结果进行自吸收修正和面积 修正。

本工作对低本底 α、β 测量仪的效率校准进行 了深入的研究,为低本底 α、β 测量仪的校准及应用 提供了重要参数,为β放射性样品活度量值传递的 准确可靠提供了计量保障。

参考文献

- [1] 容超凡. 电离辐射计量[M]. 北京: 原子能出版社, 2002.
- [2] GBT 14056.1-2008 表面污染测定.第一部分.β发射体(Eβmax0.15MeV)和α发射体[S].
- [3] JJG 853-93 低本底 α、β 测量仪检定规程.

《计测技术》2011年第1期目次

基于 RBF 神经网络的微惯性测量组合标定双轨法 D-InSAR 某型教练机副翼拉杆应力水平测试分析 形变测量的误差分析 稳态数字散斑测量仪校准方法探讨 渗透法标准湿度发生器中渗透管的研制 无线局域网测试系统研究 数字图像处理技术在表面划痕测量中的应用 基于 ASP. NET 的计量器具管理系统的设计 基于 PC104 总线的 ARINC429 航空接口卡计 CCD 多光谱辐射测温技术的应用与发展 电容式传声器自由场互易校准数据处理系统设计 飞机机翼结冰计算方法与风洞试验研究概况 提高 F-P 腔精细度方法的研究 大电流充放电电源的电流不确定度评定 单翼迷宫式滴灌带流量均匀度性能测试系统 酸度计检定及维修探讨 移相干涉技术用于运动姿态精密测量 影响罗茨气体流量计计量准确性的原因分析